

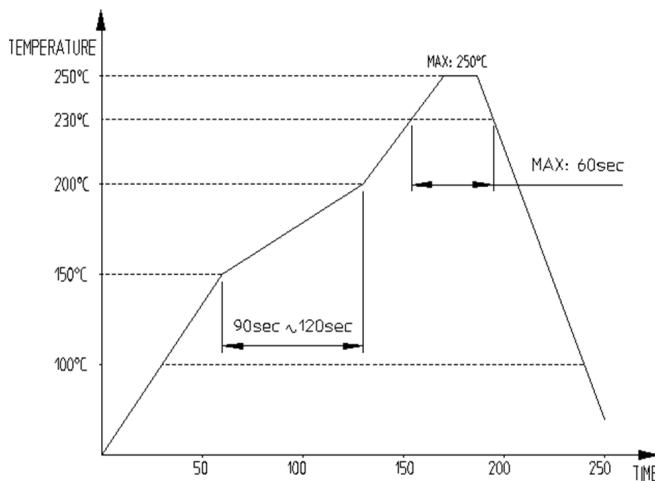
Oct.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

改定	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	改定	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△						△						
△						△						
使用規格			Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.1 Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document Revision 2.1b									
定格	電流	1.25A Max. (電源用) (A1, A4, A9, A12, B1, B4, B5, B9, B12) 0.25A (その他)										
	電圧	48V AC/DC										
使用温度範囲			-40℃ ~ +105℃(温度上昇含め), 95% RH MAX.(結露無いこと)									
保存温度範囲			-10℃ ~ +60℃(梱包状態), 15% ~ 70% RH									
	項目	試験方法	規格					QT	AT			
1	外観、構造、仕上げ	EIA 364-18 目視にて確認する。	物理的な破損が無いこと。					○	○			
電氣的性能												
2	接触抵抗	EIA 364-23 100mA(DC OR 1000Hz)以下で測定する。 4線測定が必要、PCB自体抵抗は除く。	初期 40mΩ以下 試験後、50mΩ以下					○	-			
3	耐電圧	EIA 364-20 未嵌合状態でB方法で測定する。 AC100Vの電圧を1分間印加する。	せん絡、絶縁破壊が無いこと。					○	-			
4	絶縁抵抗	EIA 364-21 嵌合/未嵌合状態でDC 500Vで測定する。	100MΩ以上					○	-			
機械的性能												
5	挿入力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。	初期 & 試験後：5N to 20N (バージンプラグ使用)					○	-			
6	抜去力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。	初期：8N to 20N 試験後：6N to 20N(バージンプラグ使用)					○	-			
7	繰り返し動作	EIA 364-09 10,000回の抜き差しを行う。 機械的稼働：500±50回/hr 嵌合ストローク：2.75mm 挿入/抜去力は12.5mm/分で測定する。	物理的な破損が無いこと。					○	-			
8	ランダム振動	EIA 364-28 試験条件 VII, 試験文字 D 周波数 20-500 Hzで、 3軸方向 各15分 振動を加える。	1us以上の電氣的瞬断がないこと。 測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること 。					○	-			
参 考			製 図	設 計	検 図	承 認	出 図					
			S.K.JANG	S.K.JANG	H.J.LEE	H.J.LEE	DEPT 22.04.15 ENG					
			21.09.28	21.09.28	21.09.28	21.09.28						
注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目												
図番			製品CLコード			製品名						
JDC4-633480			CL 6245-00001-0			CX80B2-24P						
HRS HIROSE KOREA.CO.,LTD							製品規格表				1 3	

Oct.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

項目	試験方法	規格	QT	AT
Environmental Requirements				
9	温度寿命 EIA 364-17, A方法 105℃に120時間放置する。	物理的な破損が無いこと。	○	-
10	温湿度サイクル EIA 364-31 25℃±3℃から80%±3%RHで1時間 65℃±3℃から50%±3%RHで1時間 24サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	○	-
11	熱衝撃 EIA 364-32, 試験条件 I -55℃ から +105℃温度で10サイクル実施	物理的な破損が無いこと。	○	-
12	はんだ付け性 EIA 364-52 はんだ付け部をはんだ槽245℃±5℃中に5秒間浸漬させる。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで濡れていること。	○	-
13	塩水噴霧 EIA 364-26 サンプル条件：基板に実装した後 濃度5%の塩水、試験温度35℃中に48時間放置する。	コネクタの作動に影響を与える腐食が無いこと。	○	-
14	混合流動ガス EIA 364-65 測定環境 30℃/70%RH CL ₂ 10±3ppb, NO ₂ 200±50ppb, H ₂ S 10±5ppb, SO ₂ 100±20ppb 嵌められたサンプルの半分を1/3日間露出した後、 2/3日嵌合を外して放置。 他のサンプル半分は7日間嵌合状態を維持する。	コネクタの作動に影響を与える腐食が無いこと。	○	-
15	温度上昇 EIA-364-70, B方法 5.0Aの電流はVBUS端子(A4, A9, B4, B9)に、1.25Aは 当りのGND端子(B1, B2)を通貨する復帰経路でVconn端 子(プラグ側のB5)に認可されるべきこと。 0.25Aの最少電流を他のすべての端子にも個別的に適 用すべきこと。	温度上昇値は30℃を超えないこと。	○	-
16	リフローヒート リフロー条件[図-1] ピーク250℃マックス10秒で2回リフローする。	絶縁座に異常ないこと。 プリスター等の外觀異常ないこと。	○	-

REMARKS



[Fig.1] REFLOW TEMPERATURE

注 QT：確認試験，AT：製品検査，O：適用項目

図番 JDC4-633480	製品CLコード CL 6245-00001-0	製品名 CX80B2-24P
-------------------	----------------------------	-------------------

Qualification Test Sequence Table

Para.	試験項目	試験グループ							
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	外観、構造、仕上げ	1, 6	1, 8	1, 7	1, 7	1, 14	1, 3	1, 6	1, 6
2	接触抵抗	3, 5	3, 5, 7	3, 4, 6	3, 4, 6	5, 13		3, 5	3, 5
3	耐電圧					4, 12			
4	絶縁抵抗					3, 11			
5	挿入力					6, 10			
6	抜去力					7, 9			
7	繰り返し動作					8			
8	ランダム振動			5					
9	温度寿命	4							
10	温湿度サイクル		6						
11	熱襲撃		4						
12	はんだ付け性						2		
13	塩水噴霧							4	
14	混合流動ガス				5				
15	温度上昇								4
16	リフローヒート	2	2	2	2	2		2	2

参 考

1)上記表の数字は各試験別試験する順番を表示する。

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番 JDC4-633480	製品CLコード CL 6245-00001-0	製品名 CX80B2-24P
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------